



## Plénière n°5

---

### *Métrologie 3D par tomographie rayon X*

*Par Bruno VETTICOZ, directeur général Werth France*

---

#### Résumé

Depuis maintenant plus de 7 ans Werth développe une gamme de machines à mesurer 3D par tomographie à rayons X. Cette technologie apporte des solutions de mesure jusque-là jamais proposées. Il est possible par cette technique non seulement de vérifier la conformité d'une pièce en terme de santé matière ou de fonctionnement dans le cas d'assemblage, mais aussi de pouvoir effectuer une métrologie complète pour l'extérieur comme l'intérieur de la pièce, sans aucune destruction et ce dans un temps très court. Par exemple, la validation d'un moule multi empreintes peut être ramenée à une 1/2 journée, là où plusieurs jours sont nécessaires en métrologie traditionnelle.

La conférence présentera dans un premier temps cette technologie tomographique qui, pour les machines « multisensor » Werth, peut être associée à d'autres techniques de palpation avec ou sans contact. En effet, la gamme de produits Werth s'étend du simple projecteur de profil et de mesure en passant par les machines de mesure 2 et 3D optique jusqu'aux équipements de mesure les plus avancés utilisant les capteurs multiples, tels que optique, laser, palpeurs, micro palpeurs et donc la tomographie par rayons X.

Dans un second temps, la conférence sera l'occasion de témoigner des expériences les plus convaincantes de cette technologie auprès des clients de Werth. Enfin, il sera proposé aux participants du séminaire AIP-Priméca de découvrir les logiciels de mesure 3D Werth.